Translation

PATENT COOPERATION TREATY



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

INTERNATIO	NAD 2 A Rule 7	0)
•	(PCT Article 36 and Rule 7	1 Proliminary
		. G. tomational Flemman
	SeeNO SeeNO Frami	tificationofTransmittalofInternation
Applicant's or agent's file reference	HIJE E C	
03PCFP848	International filing date (day/month/y	02 April 2002 (05.0
	International filing data (47) 31 March 2003 (31.03.200)	3) 021
International application No. PCT/JP2003/004063	31 Water 2	
PCT/JP2003/004063 International Patent Classification (IPC) or HOLL 21/768, 21/302	national classification and	1
International Patent Classification H01L 21/768, 21/302		
H01L 21/700, 22		
	- TATELO	N.
	NEC CORPORATION	
Applicant		this International Preliminary Examining Authority
		this International Preliminary
11-inary 6	examination report has been prepared of	
This international preliminary e and is transmitted to the applications.	ant according to Article 30	this cover sheet.
and is transmitted to	tal of5 sheets, including	the description, claims and/or drawings which have been the description made before this Authority (see Rule or the PCT).
This REPORT consists of a to	(al OI sheets of	the description, claims and/or drawings which have been also the description of this Authority (see Rule are the PCT).
2. This REI STA	ompanied by ANNEXES, i.e., should and/or sheets contain	ning rectifications made
This report is also de-	asis for this report and a sais for this report a sais for this report and a sais for this report a sais for th	er me 101).
amendo i Section 607	of the Admin	110
annexes consis	t of a total ofsheets.	
These amore	2 Naming items:	
t contains indicat	ions relating to the following items:	elty, inventive step and industrial applicability
		T
I Basis of the	7 E	industrial applicability
Priority	an amount to nov	elty, inventive step and musicine
II L	olishment of opinion with regard to	elty, inventive step and industrial applicability
III Non-case	finvention	gard to novelty, inventive step or industrial applicability; ment
IV Lack of v	unity of invention	gard to novelty, inventor
Reasone	d statement under Article 35(2) with re and explanations supporting such state	Milent 4
A KZI CHARON	· 	
Certain Certain	documents cited	
VI EX	the international application	
VII L	a defects in the international appling observations on the international appli	ication
VIII Certain	a observations of	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	_	
		Date of completion of this report
		Date of completion of 25 December 2003 (25.12.2003)
Date of submission of the de	mand	25 December 200
Date of March	2003 (31.03.2003)	
1		Authorized officer
13-90	of the IPEA/JP	
Name and mailing address	<u>-</u>	- Labore NO.
	_	Telephone No.
ranimile No.		

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Internal application No.
PCT/JP2003/004063

I.	Bas	is of the	report
1.	Wi	th regar	d to the elements of the international application:*
	\boxtimes	thei	nternational application as originally filed
	F	the	description:
	_	page	
		page	
		page	
	_] 4	
l	<u> </u>		claims:
		page page	
		page	Clade state at a description of
		page	
	_	٦ -	
	L_	-	drawings:
		page	
		page	
		page	, filed with the letter of
	L	the sec	quence listing part of the description:
		page	, as originally filed
l		page	, filed with the demand
		page	s, filed with the letter of
2.	the	e internations internations internations in the limited states in	d to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which tional application was filed, unless otherwise indicated under this item. Lents were available or furnished to this Authority in the following language which is: Language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). Language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). Language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/
3.	W: pre	or 5	5.3). rd to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international y examination was carried out on the basis of the sequence listing:
		ቫ	ained in the international application in written form. I together with the international application in computer readable form.
		furn	ished subsequently to this Authority in written form.
		7	ished subsequently to this Authority in computer readable form.
			statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the mational application as filed has been furnished.
		The beer	statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has a furnished.
4.		The	amendments have resulted in the cancellation of:
		Н	the description, pages
		닏	the claims, Nos.
			the drawings, sheets/fig
5.			report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go and the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**
	in and	this rep 1 70.17).	
**	Any	y replace	ement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.



Interpal	application No.
PCT, JP	03/04063

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

. Statement			
Novelty (N)	Claims	2-4, 6-11, 13, 14, 17, 18	YES
	Claims	1, 5, 12, 15, 16	NO
Inventive step (IS)	Claims	10, 11, 13, 14	YES
	Claims	1-9, 12, 15-18	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-18	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Document 1: JP 2000-114367 A (Matsushita Electronics

Corp.), 21 April 2000, entire text, fig 1-4

Document 2: JP 10-125783 A (Sony Corp.), 15 May 1998,

entire text, fig. 1-8

Document 3: JP 11-297829 A (NEC Corp.), 29 October 1999,

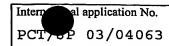
entire text, fig. 1-6

Claims 1, 5, 12, 15 and 16

Documents 1-3 cited in the international search report disclose semiconductor devices wherein a modified portion that contains nitrogen atoms is provided at the position that faces the opening in the organic insulating film, and disclose production methods for semiconductor devices wherein an opening is formed in the organic insulating film by means of etching and thereafter a modified portion is formed by means of plasma processing or the like involving nitrogen atoms.

Consequently, the inventions that are set forth in claims 1, 5, 12, 15 and 16 of this application are disclosed in documents 1-3; therefore, they lack novelty and do not involve an inventive step.

Document 4: US 6114250 A (Lam Research Corp.), 05 September 2000, entire text, fig. 1-8



Document 5: JP 2000-26484 A (Tokyo Electron Ltd.), 02 February 2000, entire text, fig. 1-14

Claims 2-4, 6-9, 17 and 18

Documents 4 and 5 cited in the international search report disclose the feature of using nitrogen gas to etch an organic insulating film, document 5 (chart 6) indicates that CH_2F_2 gas is added to the etching gas, and document 4 indicates that fluorocarbons are added in order to control the form of the film. It would be obvious to a person skilled in the art to employ the etching means that are disclosed in documents 4 and 5 in order to form openings in the semiconductor devices that are disclosed in documents 1-3, and, at that time, it would be obvious to form a modified portion that includes nitrogen atoms (and fluorine atoms) at the position that faces the opening in the organic insulating film.

Therefore, the inventions set forth in claims 2-4, 6-9, 17 and 18 do not involve an inventive step in the light of documents 1-5.

Claims 10, 11, 13, 14

The invention that is set forth in claims 10, 11, 13 and 14 is not disclosed in any of the documents cited in the international search report, and is not obvious to a person skilled in the art.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Internal application No.
PCT/JP2003/004063

1. Cert	tain published documents	(Rule 70.10)		
	Application No. Patent No.	Publication date (day/month/year)	Filing date (day/month/year)	Priority date (valid claim) (day/month/year)
	JP 2003-92287 A	28 March 2003 (28.03.2003)	19 September 2001 (19.09.2001)	

F **Y**1

12 April 2002 (12.04.2002) 27 September 2000 (27.09.2000)

[E, X]

[E, X] JP 2002-110788 A

VI. Certain documents cited

2. Non-written disclosures (Rule 70.9)

Kind of non-written disclosure

Date of non-written disclosure (day/month/year)

Date of written disclosure referring to non-written disclosure (day/month/year)





PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70] RECEIVED
2 2 JAN 2004
WIPO PCT

		- W		
出願人又は代理人 今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ の書類記号 03PCFP848 IPEA/416)を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP03/04063 国際出願日 (日.月.年) 31.03.03 優先日 (日.月.年) 03.04.02				
国際特許分類(IPC) Int. Cl ⁷ H01	L21/768, H01L21/3	0 2		
出願人(氏名又は名称) 日本電気株式会社	:			
1. 国際予備審査機関が作成したこの目 2. この国際予備審査報告は、この表紙		7条(PCT36条)の規定に従い送付する。 _ ページからなる。		
□ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で ページである。				
3. この国際予備審査報告は、次の内容	3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。			
I X 国際予備審査報告の基礎		·		
Ⅱ 優先権	π			
□ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成				
IV 開発明の単一性の欠如				
の文献及び説明				
VI X ある種の引用文献				
VII 国際出題の不備				
Ⅷ □ 国際出願に対する意見				
国際予備審査の請求書を受理した日 31.03.03		取告を作成した日 25.12.03		
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/IP)	特許庁審査官	(権限のある職員) 4L 8122		

齋藤 恭一

電話番号 03-3581-1101 内線

3498

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号





Ι. [国際予備審査幸	母告の基礎 現告の基礎		
,		と提出された差し替え用紙は、		れた。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に おいて「出願時」とし、本報告書には添付しない。
X	出願時の国際	祭出願書類		
	明細書 明細書 明細書	第 第 第 	_ ページ、 _ ページ、 _ ページ、 _ ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲		項、 項、 項、 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 「付の書簡と共に提出されたもの
	図面 図面 図面	第 	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
	明細書の配列	刊表の部分 第 刊表の部分 第 刊表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出顧時に提出されたもの 国際予備審査の請求事と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
2	上記の出願書類	領の言語は、下記に示す場合	を除くほか、こ	の国際出願の言語である。
	上記の書類は、	下記の言語である	語であ	ప .
	РСТ規	のために提出されたPCT規 則48.3(b)にいう国際公開の 審査のために提出されたPC	言語	
3.	この国際出願に	は、ヌクレオチド又はアミノ	酸配列を含んで	おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。
□ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった □ 書の提出があった □ む面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。				
	補正により、 ⁻ 明細書 請求の範囲 図面	F記の書類が削除された。 第 第 図面の第	項	ジ / 図
5. この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)				
				-





v.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、そ 文献及び説明	されを 裏付ける
1.	見解	

請求の範囲2-4, 6-11, 13, 14, 17, 18請求の範囲1, 5, 12, 15, 16 新規性(N) 有

請求の範囲 10,11,13,14 請求の範囲 1-9,12,15-18 進歩性(IS) 有

請求の範囲 1-18 有 産業上の利用可能性 (IA) 請求の範囲

文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: JP 2000-114367 A (松下電子工業株式会社) 2000.04.21,全文,第1-4図 文献2: JP 10-125783 A (ソニー株式会社)

1998.05.15,全文,第1-8図 文献3:JP 11-297829 A (日本電気株式会社)

1999.10.29,全文,第1-6図

請求の範囲1,5,12,15,16 国際調査報告で引用した文献1-3には、有機絶縁膜の開口に面する位置に、窒素原子を含む改質部を備えた半導体装置、及び、有機絶縁膜をエッチングに対用 を形成した後、窒素原子を含むプラズマ処理等により改質部を形成する半導体装置 の製造方法が記載されている。

よって、請求の範囲1, 5, 12, 15, 16 されたものであり、新規性、進歩性を有しない。 12, 15, 16に係る発明は、文献1-3に記載

文献4:US 6114250

(LAM RESEARCH CORPORATION)

2000.09.05,全文,第1-8図 文献5:JP 2000-36484 A (東京エレクトロン株式会社) 2000.02.02,全文,第1-14図

請求の範囲2-4, 6-9, 17, 18 国際調査報告で引用した文献4, 5 には、有機絶縁膜のエッチングに窒素ガスを用いることが記載されており、文献5 (表 6) には、エッチングガスに CH_2F_2 ガスを添加することが、また文献4には、形状制御のためにフルオロカーボンを加えることが開示されている。文献1-3記載の半導体装置の開口を形成するために文献4, 5 に記載のエッチング手段を採用することは、当業者にとって自明のことであり、このとき、有機絶縁膜の開口に面する位置に窒素原子(及びフッ素原子)を含む改質部が形成されることは、当然のことである。よって、請求の範囲2-4, 6-9, 17, 18 に係る発明は、文献1-5 により、進歩性を有しない

り、進歩性を有しない。





国際出願番号 PCT/JP03/04063

VI.	ある種の引用文献			
1.		70. 10)		
 -	出願番号 特許番号	公知日 (日.月.年)	出願日 (日.月.年)	優先日(有効な優先権の主張) (日.月.年)
	JP 2003-92287 A	28. 03. 03	19. 09. 01	
	JP 2002—110788 A	12. 04. 02	27. 09. 00	

2. 書面による開示以外の開示()	P C	こT規則70.9)
-------------------	------------	-----------

書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開示の日付	書面による開示以外の開示に言及している
	(日.月.年)	書面の日付(日.月.年)



国際出願番号 PCT/JP03/04063

補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V.2. 欄の続き

請求の範囲10, 11, 13, 14 請求の範囲10, 11, 13, 14に係る発明は、国際調査報告で引用したいず れの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明のものでもない。